1. **口井 敏匡, 四柳 浩之 :** 半導体集積回路，スキャン回路設計方法，テストパターン生成方法，および，スキャンテスト方法, 特願2004-225962 (2004年8月), 特開2006-047013 (2006年2月), .
2. **橋爪 正樹, 一宮 正博 :** 電源電流による検査容易化論理回路, 特願2006-112885 (2004年10月), .
3. **橋爪 正樹, 一宮 正博, 四柳 浩之 :** 電子回路の断線故障検査法とその検査容易化回路, 特願2006-309430 (2006年11月), 特開2008-122338 (2008年5月), .
4. **宋 天, 山田 篤, 島本 隆 :** 算術符号化装置，算術符号化方法，算術符号化プログラム及びプログラムを格納したコンピュータで読み取り可能な記録媒体, 特願2008-503883 (2007年3月), 特開WO2007/102518 (2007年9月), 特許第4547503号 (2010年7月).